計測自動制御学会東北支部 第 272 回研究集会 (2012.5.30) 資料番号 272-5

双曲面型体積インターフェログラムを直接取得する 干渉計の検討

An interferometer for direct-measurement of hyperbolic-type volume interferogram

○橋本哲弥*, 平井亜紀子**, 吉森久*

OTetsuya Hashimoto*, Akiko Hirai** and Kyu Yoshimori*

*岩大院工,**産総研

*Graduate School of Eng., Iwate Univ. **AIST

キーワード:干渉計測(Interferometry),デジタルホログラフィ(Digital holography),3 次元イメージ ング(Three-dimensional imaging),分光イメージング(Spectral imaging), フーリエ分光法(Fourier spectrometry)

連絡先:〒020-8551 岩手県盛岡市上田 4-3-5 岩手大学 工学研究科 電気電子・情報システム工学専攻 吉森研究室 橋本哲弥, Tel.: (019)621-6485, Fax.: (019)621-6485, Email: <u>tetsuya@ql.cis.iwate-u.ac.jp</u>

1. はじめに

われわれはこれまでパッシブな干渉計測と 計算機処理による連続スペクトル帯毎の物 体の3次元形状,分光立体画像を取得する, 全干渉型3次元イメージング分光法の研究を おこなってきた¹⁻⁶⁾. この手法では、干渉計に 3 つのパラメータを与えながら干渉計測を行 い、複数の干渉縞画像を取得する.このデー タセットを5次元インターフェログラムと呼 ぶ.分光立体画像の再生は、5次元インター フェログラムから次元圧縮することで得ら れる体積インターフェログラムから行われ る.この次元圧縮を合成開口処理と呼ぶ.合 成開口処理は、各干渉縞画像の1点の選択と、 新しい3次元の座標にその1点を再配列とい う2つの処理で行われる. 選択と再配列に与 えられるルールをそれぞれ選択律、再配列条 件と呼ぶ.

従来の合成開口処理では、光源から伝搬し た光波の波面形状を記録した体積インター フェログラムを取得するための選択律が用 いられてきた。しかし、光波の波面形状を直 接には反映しないものの、同様な光源情報を 有する体積インターフェログラムを取得す る選択律が確認されている.この体積インタ ーフェログラムを双曲面型体積インターフ ェログラムと呼ぶ^{5,6}.双曲面型体積インター フェログラムはその選択律の特徴から,干渉 計測から直接取得する干渉計を構築するこ とができると考えられてきた⁶⁾.本研究はそ の干渉計を実現するための予備実験につい て報告をおこなう.

2. 原理

従来の2光波折り畳み干渉計¹⁻⁵⁾では,測定対象を動かすことで光学系を相対的に移動させて測定していた.そのため,干渉光を観測する面の座標と測定対象の持つ座標を,測定対象の移動量パラメータにより対応付ける 必要があった.双曲面型体積インターフェロ グラムを取得するための選択律は,観測面上 では移動量パラメータに応じて変動する.し かし,この選択律は測定対象の座標上ではそ の原点座標に定まる.このことから,光源座 標と観測面座標の原点を一致させた干渉計 を考えたとき,その原点のみを観測すること で双曲面型体積インターフェログラムが直 接取得できると考えられる.この考えを基に 提案した干渉計を図1に示す.



光源Sから伝搬した光波はビームスプリッ タ(BS)により分割される.分割された光波は それぞれプリズム P 及び P で反射し、BS に より再び重なる. プリズム P は v ステージ, x ステージに乗せられており、 P、P'は互い に直交である. P, P'のエッジの位置は \hat{y},\hat{x} と 与えられ、入射した光波をエッジに対して反 転反射させる.再び重ね合った光波は単一検 出器(D)に入射する.BSとDの間にはレンズ (L)と開口(A)が置かれ、光軸上の光強度のみ が観測される.x-y座標上の原点の光強度を観 測する.また、P は分割された光波に光路差 を導入するため、PZT を用い光軸方向にも動 かす. x ステージ, y ステージ, PZT の3 軸を 走査しながら、Dにより光強度を観測するこ とで、3次元のデータ構造を取得する.これ が双曲面型体積インターフェログラムであ る. この体積インターフェログラムからは, 従来の2光波折り畳み干渉計から取得される 双曲面型体積インターフェログラムと同様 な処理により測定対象の分光立体像を取得 することが出来る⁵⁾.

図1の干渉計は、CCDの代わりに点検出器 を用いるため、干渉縞の高感度な計測が期待 でき、さらに、この検出する光に対し白色へ テロダイン検出技術を用いる⁷⁻⁸⁾ことで大幅 な信号対雑音比の改善が期待できる.

3. 実験

提案した干渉計の実現性の検討のために、従 来の2光波折り畳み干渉計により5次元イン ターフェログラムを取得され、さらに合成開 ロ処理により取得した双曲面型体積インタ ーフェログラムから分光立体像を再生した. これにより取得される体積インターフェロ グラムと提案した干渉計から得られる体積 インターフェログラムは、どちらも同じ処理 により分光立体画像を取得することが可能 である.

光源には LED と先端を削ったアクリル棒 を組み合わせた2色の光源を用いた.図2に, この実験により再生された分光立体画像の 1つを示す.このように,双曲面型体積イン ターフェログラムから分光立体画像の取得 が可能であることを確認した.今回提案した 干渉計から取得した双曲面型体積インター フェログラムからも,同様の処理で分光立体 像の取得が可能であると期待できる.



図 2 インフォーカスした, 波長 458nm, 距離 95mm における分光立体画像

4. おわりに

われわれは双曲面型体積インターフェログ ラムの直接取得を目指す干渉計の構築を進めており、予備実験として従来の2光波折り 畳み干渉計によ取得した双曲面型体積イン ターフェログラムからの分光立体画像が再 生可能であることを確認した.

本研究は科研費 22560031 の助成を受けたものである。

参考文献

1) K. Yoshimori: J. Opt. Soc. Am. A 18(2001) 765.

2) K. Yoshimori: Proc, SPIE 6252, (2006) 625221-2.

3) M. Sasamoto and K. Yoshimori. Jpn. J. Appl. Phys. 48 (2009) 09LB03-1.

4) M. Sasamoto and K. Yoshimori: Opt. Rev. 19, (2012) 29-33.

5) T. Hashimoto and K. Yoshimori: Proc. of the Digital Holography and Three-Dimensional Imaging(DH2011)DWC38.

6) T. Hashimoto, A. Hirai, and K. Yoshimori: International Workshop on Holography 2011 (IWH2011) P02.

7) A. Hirai and H. Matsumoto: Opt. Eng. 40, (2001), 387-391.

8) A. Hirai, T. Hashimoto and K. Yoshimori,: Annual meeting of JSAP, March 2011, 24p-KT-12.